

高分子材料分析机构，扫描电镜费用

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高分子材料分析机构，扫描电镜费用 |
| 公司名称 | 无锡万博检测科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼 |
| 联系电话 | 13083509927 18115771803 |

产品详情

高分子材料分析机构，扫描电镜费用

物理学

SEM可用于观测液晶显示器导电粉粒径分布、导电粉在导电点中的浓度和分析导电点缺陷，观察薄膜传感器压阻灵敏度，分析材料晶体结构和表面形貌对尖晶石颗粒导电性的影响，观察镀膜形貌和厚度对提高导电塑料表面硬度和强化表面导电行为的影响等6。

工业应用

SEM可用于半导体微观形貌检测和成分分析，用于确定切割、研磨、抛光及各种化学试剂处理对半导体器件的性能和稳定性的影响；分析不同元素、化合物添加量对陶瓷烧结体性能、晶相组成及晶粒形貌的影响，用于改进陶瓷生产工艺；对化工产品的微观形态观察，结合其性质变化，对工艺条件选择、控制、改进、优化以及产品品质鉴定等6。

特点

优点

SEM是一种高分辨率的电镜，可以直接观察样品表面，图像富有立体感，真实感。而且它除了能显示一般试样表面的形貌外，还能将试样微区范围内的化学元素与光、电、磁等性质的差异以二维图像形式显示出来，并可用照相方式拍摄图像。另外，扫描电镜分辨本领高，观察试样的景深大，可直接观察试样表面起伏较大的粗糙结构30。

缺点

SEM分辨率不及TEM（透射电镜）和AFM（原子力显微镜）31，不能观察到物质的分子和原子像；试样需置于真空环境下观察，限制了样品的类型；只能观察样品表面形貌，表面以下结构不能探测；没有高度方向信息，只有二维平面图像；不能观察液体样品32。

